

表面汚染密度測定について

No.	Page	質問・コメント等
10	本文 P16,17 (表面汚染密度)	表面汚染密度測定について、審査基準では不確かさを含めて評価することとなっているため、不確かさを考慮しても $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ を下回る測定ができるとの説明を追記すること。

今回の認可申請書に記載した放射能確認対象物の表面汚染密度 (^{60}Co 相当：以下、 ^{60}Co 相当の表面汚染密度は「 ^{60}Co 相当」の記載を省略する。) の測定方法は、**当初**、前回の認可申請書同様に表面汚染密度が $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であることを確認可能であり、放射能濃度換算係数における表面汚染密度の設定値を $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ を用いるとしていたが、審査基準において不確かさに関する要求が明確になったことを考慮し再検討した結果、不確かさを考慮した表面汚染密度は $1.3\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であることから、放射能濃度換算係数における表面汚染密度の設定値は $1.3\text{Bq}/\text{cm}^2$ とする。

以下の測定手順や測定条件によって**不確かさを考慮しない場合**に確認できる表面汚染密度が $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であり、線源を用いた実証試験によりその妥当性について確認している。また**不確かさを考慮した場合**に確認できる表面汚染密度は $1.3\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であることから、放射能濃度換算係数における表面汚染密度の設定値を $1.3\text{Bq}/\text{cm}^2$ とする。以下にその詳細を示す。

1. 表面汚染密度の測定の手順

表面汚染密度の測定方法として、放射線測定装置にて放射能濃度確認対象物の全面に対して走査させ、スクリーニングを行う。スクリーニングにて、表面汚染の可能性が有ると判断した部位については、放射線測定装置を静止させて詳細サーベイを行い、表面汚染の有無を判断する。**表面汚染密度を一様と見做す最小面積は 100cm^2 とする。**

表面汚染密度の測定手順の詳細は、以下のとおり。

<事前準備>

- 放射線測定装置が校正期限内であり機器効率、使用環境が基準を満足していることを確認し、日常点検を行う。

<BG 測定>

- 放射線測定場所にて BG 値が基準を満足していることを確認する。

<スクリーニング>

- GM 管式サーベイメータ（以下、「GM 管」という。）、**プラスチックシンチレーション式サーベイメータ（サーベイメータ型）**（以下、「 β シンチ」という。）及び**プラスチックシンチレーション式サーベイメータ（据置型）**（以下、「据置型」という。）にて、放射能濃度確認対象物の全面に対して放射線測定装置にて走査させ直接測定法

を行う。

- ・GM管及び β シンチは、放射線測定装置と放射能濃度確認対象物の表面との距離は5mm以内とする。(据置型は、30mm以内となるよう検出器が上下に移動する。)(放射線測定装置の校正時の標準線源(^{60}Co)との距離と同じ)
- ・GM管及び β シンチは、放射線測定装置と放射能濃度確認対象物の表面との距離が5mmを超える場合は、間接測定法にて測定を行う。(据置型は、凹凸がない平らな物のみ)
- ・GM管及び β シンチは、判定値(スクリーニングから詳細サーベイに移行する計数率)を上回る値を計測した場合、その部位について静止させて詳細サーベイを行う。(据置型は検出限界値を上回った場合、自動停止する。)

<詳細サーベイ>

- ・詳細サーベイはGM管又は β シンチを静止させ測定を行い、BG値に応じた検出限界計数率以上を計測した場合、その部位については安全側に $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であったとしても表面汚染があるものと判断し、除染を行う。
- ・BG値に応じた検出限界計数率未満となった場合、その部位については $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 以上の表面汚染がないものと判断し、スクリーニングを再開する。

<間接測定法>

- ・間接測定法は、スミア紙を用いて測定対象物の全面を 100cm^2 毎拭き取る。拭き取り効率0.1としてスミア紙をGM管にて測定する。BG値に応じた検出限界計数率以上を計測した場合、その部位については安全側に $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であったとしても表面汚染があるものと判断し、除染を行う。

2. 具体的な測定条件及び検出限界値

表面汚染密度測定の測定条件及び検出限界値の算出式を本回答書の表-1に示し、また検出限界値の算出結果を本回答書の表-2に示す。

- ・GM管及び β シンチを用いた直接測定法によるスクリーニングにおける詳細サーベイへ移行する判定値は検出限界計数率以下で管理する自主的な運用として定めた値である。この計数率に相当する表面汚染密度は $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であることを確認した。また、この判定値に対して計数率の標準偏差の1.645倍を加えた計数率に相当する表面汚染密度は $1.3\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であることを確認した。
- ・GM管及び β シンチを用いた詳細サーベイにおける検出限界値、またGM管を用いた間接測定法における検出限界値は $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満である。また、不確かさを考慮した表面汚染密度の値(検出限界計数率に標準偏差の1.645倍を加えた計数率に相当する値)は、 $1.3\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であることを確認した。
- ・据置型では、BG基準値を設定していないが、機器効率及びBG値に応じた検出限界計数率における検出限界値が $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 以上となると自動停止する。据置型は自動判定のためBG値及び機器効率に応じた検出限界値となる。BG値を $0\sim50\text{cps}$ の範囲でそれぞれ検出限界計数率を求める。求めた検出限界計数率を検出値と扱い、

検出限界計数率に標準偏差の1.645倍を加えた計数率に相当する表面汚染密度の値を求めた結果、最大で $1.24\text{Bq}/\text{cm}^2$ であり $1.3\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であることを確認した。

- ・以上より、GM管、 β シンチ及び据置型を用いた上記の表面汚染密度の測定手順及び測定条件において、不確かさを考慮した表面汚染密度の値は、 $1.3\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満である。

3. 実証試験について

実際に $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ の汚染を検出できることを以下のとおり実証試験を実施し確認した。

試験方法は以下のとおり

- ・Ge半導体検出器にて放射能量を定量した放射性物質をステンレス皿に滴下、乾燥させ $0.6\text{Bq}/\text{cm}^2$ (①)、 $0.7\text{Bq}/\text{cm}^2$ (②)、 $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ (③)の実証試験用試料を各1枚作成。
- ・汚染が付着していない実証試験用試料(ダミー： $0\text{Bq}/\text{cm}^2$) (④)を4枚用意。
- ・GM管及び β シンチは、実際に現場で測定を行っている放射線管理員10名にてそれぞれ①、②、③及び④の7枚の実証試験用試料についてスクリーニングを行い、各実証試験用試料について汚染の有無を判断させる。
- ・据置型は、①、②及び③の3枚の実証試験用試料について測定を10回行い、各実証試験用試料について汚染の有無を判断させる。

結果、GM管及び β シンチは、 $0.6\text{Bq}/\text{cm}^2$ は90%、 $0.7\text{Bq}/\text{cm}^2$ 及び $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ は100%汚染の有の判断が可能であった。また据置型は $0.6\text{Bq}/\text{cm}^2$ 及び $0.7\text{Bq}/\text{cm}^2$ は50～60%、 $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ については100%汚染の有の判断が可能であった。(詳細は別紙参照)

従って、すべての放射線測定装置において $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ の実証試験用試料を100%汚染の有の判断が可能であったことから、表面汚染密度が $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であることの確認は可能であると判断した。

4. まとめ

以上より、不確かさを考慮しない表面汚染密度 $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満となり、これは、前回の認可申請書と同様であるが、審査基準において不確かさに関する要求が明確になったことを考慮し不確かさを考慮した放射能濃度換算係数における表面汚染密度の設定値は $1.3\text{Bq}/\text{cm}^2$ を用いる。

<補足>

認可申請書に記載の表面汚染密度((本文)表-10 二次的な汚染の調査結果(汚染の程度)等)は、 $2.2\text{E-}02\text{Bq}/\text{cm}^2$ 等、上述の値を大きく下回る。この表面汚染密度測定の目的は、上述のような $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満であることの確認ではなく、汚染の程度の調査であり、表面汚染密度の測定方法が異なる。測定方法は上述の $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満で

2024 年 1 月 18 日

あることを確認する方法ではなく、 β シンチを用いたスケーラモードによる 500 秒の静止測定である。このため、検出限界値が異なる。

以上

表-1 測定条件

放射線測定装置	検出器	GM管式サーベイメータ	プラスチックシンチレーション式サーベイメータ	
	型	サーベイメータ型		据置型
	略称	GM管	βシンチ	据置型
測定方法	直接測定法	間接測定法	直接測定法	直接測定法
線源効率（＊）	0.4	0.4	0.4	0.4
機器効率	0.30以上	0.30以上	0.38以上	※1
検出器の入射窓面積又は線源面積	19.6cm ²	—	100cm ²	100cm ² ※2
BG測定	時定数	30秒 (0.5分)	30秒 (0.5分)	30秒 (0.5分)
	測定時間	90秒	90秒	90秒
	BG基準値	100cpm 以下	100cpm 以下	500cpm 以下
スクリーニング	時定数	3秒 (0.05分)	—	3秒 (0.05分)
	走査速度・測定時間	1cm/秒	—	4cm/秒
	検出器走査方向長さ	5cm	—	5.9cm
	表面との距離	5mm	—	5mm
	拭き取り面積	—	—	—
	拭き取り効率	—	—	—
詳細サーベイ	検出限界計数率	30cpm※4	—	150cpm※4
	時定数	10秒 (0.17分)	30秒 (0.5分)	10秒 (0.17分)
	測定時間	30秒	90秒	30秒
	拭き取り面積	—	100cm ²	—
	拭き取り効率	—	0.1	—
	検出限界計数率	※5	※5	※5

* : 線源効率は、「放射性表面汚染密度の評価における線源効率の実験研究 ((財)電力中央研究所)」より ^{60}Co を滴下、乾燥させた金属材 (アルミニウム、鉄材、鉛、ステンレス (みがき、粗面、水性ペイント)) において 0.4 以上の結果を得ていることから 0.4 とした。

※1 : 据置型は、機器効率及び BG 値に応じて検出限界値が自動計算され、 $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ を下回る値となることを自動で確認する。

※2 : 据置型の検出器の入射窓面積は、52cm×31cm である。

※3 : スケーラ方式であり時定数を持たない。測定時間は 15.3 秒。

※4 : GM管及びβシンチを用いた直接測定法によるスクリーニングにおける詳細サーベイへ移行する判定値は検出限界計数率以下で管理する自主的な運用として定めた値である。

※5 : BG 値に応じた検出限界計数率。

※6 : 検出限界値が $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ となる機器効率に応じた検出限界計数率。

(1) GM管及び β シンチの表面汚染密度の算出

ア. 検出限界計数率の算出

$$Nd = \frac{k}{2} \left[\frac{k}{2Ts} + \sqrt{\left(\frac{k}{2Ts}\right)^2 + 2Nb \left(\frac{1}{Ts} + \frac{1}{Tb}\right)} \right]$$

 Nd : 検出限界計数率 (cpm) Nb : BG 計数率 (cpm) k : 標準偏差の倍数, 3 (-) Ts : 測定時の時定数 (分) Tb : BG 計数率測定時の時定数 (分)

イ. 走査による指示率

$$Ev = 1 - \exp\left(-\frac{L/v}{ts}\right)$$

 Ev : 指示率 (-) L : 検出器走査方向長さ(cm) v : 走査速度(cm/秒) ts : 測定時の時定数(秒)

ウ. 計数率 (cps) の標準偏差

$$\sigma = \sqrt{\sigma_n^2 + \sigma_b^2}$$

ここで

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{n_s}{2ts}}$$

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{n_b}{2tb}}$$

 σ : 計数率 (cps) の標準偏差 (cps) σ_n : 測定時の標準偏差 (cps) σ_b : BG 計数率測定時の標準偏差 (cps) n_s : 測定時のグロス計数率 (cps) ts : 測定時の時定数(秒) n_b : BG 計数率 (cps) tb : BG 計数率測定時の時定数(秒)

エ. 不確かさを考慮した表面汚染密度

$$Ad = \frac{Nd + 1.645\sigma \times A}{S \times \varepsilon i \times \varepsilon s \times A \times Ev}$$

Ad : 表面汚染密度 (Bq/cm²)
 Nd : 判定値または検出限界計数率 (cpm)
 σ : 計数率 (cps) の標準偏差 (cps)
 S : 検出器の入射窓面積 (cm²)
 ε_i : 機器効率 (–)
 ε_s : 線源効率 (–)
 A : 分から秒への換算数, 60 (秒/分)
 EV : 指示率 (–)

(2) 据置型の表面汚染密度の算出

ア. 検出限界計数率の算出

$$Nd = \frac{k}{2} \left[\frac{k}{Ts} + \sqrt{\left(\frac{k}{Ts}\right)^2 + 4Nb \left(\frac{1}{Ts} + \frac{1}{Tb}\right)} \right]$$

Nd : 検出限界計数率 (cpm)
 Nb : BG 計数率 (cpm)
 k : 標準偏差の倍数, 3 (–)
 Ts : 測定時間 (分)
 Tb : BG 測定時間 (分)

イ. 運用管理値

$$Ad' = \frac{Nd}{Ws \times \varepsilon_i \times \varepsilon_s \times A} < 0.8$$

Ad' : 検出限界値 (Bq/cm²)
 Nd : 検出限界計数率 (cpm)
 Ws : 線源面積 (cm²)
 ε_i : 機器効率 (–)
 ε_s : 線源効率 (–)
 A : 分から秒への換算数, 60 (秒/分)

ウ. 計数率 (cps) の標準偏差

$$\sigma = \sqrt{\sigma_n^2 + \sigma_b^2}$$

ここで

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{Ns}{Ts}}$$

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{N_b}{Tb}}$$

σ : 計数率 (cps) の標準偏差 (cps)
 σ_n : 測定時の標準偏差 (cps)
 σ_b : BG 計数率測定時の標準偏差 (cps)
 N_s : 測定時のグロス計数率 (cps)
 T_s : 測定時間(秒)
 N_b : BG 計数率 (cps)
 Tb : BG 測定時間(秒)

エ. 不確かさを考慮した表面汚染密度

$$Ad = \frac{Nd + 1.645\sigma \times A}{Ws \times \varepsilon i \times \varepsilon s \times A}$$

Ad : 検出限界値 (Bq/cm²)
 Nd : 検出限界計数率 (cpm)
 σ : 計数率 (cps) の標準偏差 (cps)
 Ws : 線源面積 (cm²)
 εi : 機器効率 (—)
 εs : 線源効率 (—)
 A : 分から秒への換算数, 60 (秒/分)

表-2 算出結果

直接測定法

放射線測定装置		GM 管	β シンチ
スクリーニング	判定値 (cpm)	30	150
	σ : 計数率の標準偏差 (cpm)	37.4	83.7
	判定値 + 1.645 σ (cpm) *	92	288
	判定値 + 1.645 σ (cpm) における表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.80	0.812
詳細サーベイ	検出限界計数率 (cpm)	75	148
	σ : 計数率の標準偏差 (cpm)	25.0	58.7
	検出限界計数率 + 1.645 σ (cpm) *	116	245
	検出限界計数率 + 1.645 σ (cpm) における表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.823	0.269

* : BG 計数率は、GM 管 : 100cpm, β シンチ : 500cpm の時の値

注) 検出限界計数率 + 1.645 σ (cpm) における表面汚染密度が、一番高くなるよう機器効率及び BG 基準値を設定して算出。

間接測定法

放射線測定装置		GM 管
100cm ² 拭き取り 測定	検出限界計数率 (cpm)	47
	σ : 計数率の標準偏差 (cpm)	15.7
	検出限界計数率 + 1.645 σ (cpm) *	73
	検出限界計数率 + 1.645 σ (cpm) における表面汚染密度 (Bq/cm ²)	1.01

* : BG 計数率は、100cpm の時の値

注) 検出限界計数率 + 1.645 σ (cpm) における表面汚染密度が、一番高くなるよう機器効率及び BG 基準値を設定して算出。

据置型

BG 値 (cps)	0	10	20	30	40	50
機器効率 (%)	1.84	8.85	12.1	14.6	16.7	18.6
検出限界計数率 (cps)	0.588	2.83	3.87	4.66	5.34	5.93
検出限界計数率 + 1.645 σ (cps)	0.911	4.38	5.98	7.22	8.26	9.18
検出限界計数率 + 1.645 σ における表面汚染密度 (Bq/cm ²)	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.23

注) 据置型は自動判定のため BG 値及び機器効率に応じた事例を示す。

汚染測定の実証試験結果について

クリアランス制度を適用する解体撤去物の表面汚染密度の測定は、GM 管式サーベイメータ及びプラスチックシンチレーション式サーベイメータ（サーベイメータ型及び据置型）を用いる。社内規定において測定器の検出限界値が $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満となる測定条件の基、測定を実施することとしているが、検出限界値付近の表面汚染が存在した場合、当該汚染を検出できる確率は 50%である。

つまり、当該汚染を見逃す確率も 50%である。

そのため、 $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ の汚染を確実に検出するために、 $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ を十分に下回る検出限界値で表面汚染を測定する必要がある。

今回、実際に解体撤去物の表面汚染密度を測定する条件において、各測定器で $0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 相当の表面汚染測定を実施し、検出の可否を確認した。

詳細な内容については、以下のとおり。

1 実証試験方法

(1) GM 管式サーベイメータ及びプラスチックシンチレーション式サーベイメータ（サーベイメータ型）

- ① 実証試験用試料を 7 枚 ($0.6, 0.7, 0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ の汚染が付着した実証試験用試料を各 1 枚、汚染が付着していない実証試験用試料を 4 枚) を準備する。
- ② 測定器(管理区域内に配備している測定器で最も機器効率が低いもの)を準備する。
- ③ 7 枚の実証試験用試料に対して走査測定で測定し、汚染の検出の可否を確認する。

上記の方法を放射線管理員 10 名が実施した。

(2) プラスチックシンチレーション式サーベイメータ（据置型）

- ① 実証試験用試料を 4 枚 ($0.4, 0.6, 0.7, 0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ の汚染が付着した実証試験用試料を各 1 枚) 準備する。
- ② プラスチックシンチレーション式サーベイメータ（据置型）の各検出器において、検出感度が最も悪い箇所に実証試験用試料を配置する。
- ③ 走査測定： $20\text{mm}/\text{秒}$ では $0.6, 0.7, 0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ の実証試験用試料、走査速度： $10\text{mm}/\text{秒}$ では $0.4, 0.6, 0.7, 0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ の実証試験用試料を測定し、汚染の検出の可否を確認する。

上記の方法を検出器 ch.1～4 で各 10 回実施した。

2 実証試験用試料

実証試験を実施するにあたり、表1及び図1に示す実証試験用試料（表面汚染密度の模擬サンプル）を作製した。

(1) 作製方法

- ① 放射性物質を含む液体をGe半導体検出器付波高分析装置を用いて、放射能量を定量する。
- ② 定量した放射能量を基に、ステンレス皿5枚で表1に示す表面汚染密度となるように液体をステンレス皿へ適量分取する。
- ③ ステンレス皿に分取した液体を乾固させ、ガスフロー比例計数装置により表面汚染密度を定量し、ステンレス皿5枚で表1に示す表面汚染密度であることを確認する。
- ④ 定量したステンレス皿5枚を配置した実証試験用試料を作製する。

表1 実証試験用試料の仕様

試料面積（ステンレス皿 底面）	$18.9\text{cm}^2 \times 5\text{枚} = 94.5\text{cm}^2$
表面汚染密度（Bq/cm ² ）*	0.4, 0.6, 0.7, 0.8

*汚染が付着した実証試験用試料を4種各1枚、汚染が付着していない実証試験用試料を4枚製作

図1 実証試験用試料の外観



3 実証試験結果

- (1) GM 管式サーベイメータ及びプラスチックシンチレーション式サーベイメータ (サーベイメータ型)

放射線管理員 10名による汚染検出率は下表のとおり。(詳細は添付資料(1)を参照)

●GM 管式サーベイメータ

検出限界値 : 0.65Bq/cm²

表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.6	0.7	0.8
汚染検出率 (%)	90	100	100

●プラスチックシンチレーション式サーベイメータ (サーベイメータ型)

検出限界値 : 0.52Bq/cm²

表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.6	0.7	0.8
汚染検出率 (%)	80	100	100

以上の結果より、0.8Bq/cm² 及び 0.7Bq/cm² の汚染は、汚染検出率が 100%となつた。検出限界値付近の 0.6Bq/cm² の汚染は、汚染検出率が 50%程度となると考えられるが、検出器より発する検出音や検出器の指示針の変動により、放射線管理員の感覚によって『汚染している』と保守的な判断をする傾向にあることから、実際の汚染検出率は 50%よりも高くなつたと評価する。

- (2) プラスチックシンチレーション式サーベイメータ (据置型)

プラスチックシンチレーション式サーベイメータ (据置型) による汚染検出率は下表のとおり。(詳細は添付資料(2)を参照)

●プラスチックシンチレーション式サーベイメータ (据置型)

【走査速度 : 20mm/秒】

ch.No.	1	2	3	4
検出限界値 (Bq/cm ²)	0.63	0.63	0.64	0.66

ch.No.	1			2		
	表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
汚染検出率 (%)	60	60	100	60	60	100
ch.No.	3			4		
	表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
汚染検出率 (%)	50	50	100	50	60	100

【走査速度：10mm/秒】

ch.No.	1	2	3	4
検出限界値 (Bq/cm ²)	0.48	0.47	0.45	0.49

ch.No.	1				2			
	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8
表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8
汚染検出率 (%)	50	70	100	100	30	50	100	100
ch.No.	3				4			
	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8
表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8
汚染検出率 (%)	50	60	100	100	30	50	100	100

以上の結果より、0.8Bq/cm²の汚染は、汚染検出率が100%となった。検出限界値付近の汚染は、概ね汚染検出率の理論値50%程度となったと評価する。

4 添付資料

- (1) GM 管式サーベイメータ及びプラスチックシンチレーション式サーベイメータ（サーベイメータ型）による測定結果
- (2) プラスチックシンチレーション式サーベイメータ（据置型）による測定結果

以上

2024年1月18日
添付資料（1）

GM管式サーベイメータ及びプラスチックシンチレーション式サーベイメータ
(サーベイメータ型)による測定結果

1 GM管式サーベイメータによる測定結果

BG : 80cpm 検出限界値 : 0.65Bq/cm²

測定員	表面汚染密度 (Bq/cm ²)		
	0.6	0.7	0.8
1	○	○	○
2	○	○	○
3	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
7	○	○	○
8	○	○	○
9	○	○	○
10	×	○	○
汚染検出率 (%)	90	100	100

○ : 汚染検出, × : 汚染検出せず

2 プラスチックシンチレーション式サーベイメータ(サーベイメータ型)による測定結果

BG : 400cpm 検出限界値 : 0.52Bq/cm²

測定員	表面汚染密度 (Bq/cm ²)		
	0.6	0.7	0.8
1	○	○	○
2	○	○	○
3	○	○	○
4	×	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
7	×	○	○
8	○	○	○
9	○	○	○
10	○	○	○
汚染検出率 (%)	80	100	100

○ : 汚染検出, × : 汚染検出せず

2024年1月18日
添付資料（2）（1／2）

プラスチックシンチレーション式サーベイメータ（据置型）による測定結果

1 走査速度：20mm/秒

ch.No.	1	2	3	4
BG 計数率 (cps)	26.9	27.5	27.5	29.5
検出限界値 (Bq/cm ²)	0.63	0.63	0.64	0.66

ch.No.	1			2				
	表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.6	0.7	0.8	表面汚染密度 (Bq/cm ²)	0.6	0.7	0.8
1	○	×	○	×	×	○	○	○
2	×	×	○	○	○	○	○	○
3	×	○	○	×	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○	○	○	○
5	○	○	○	×	○	○	○	○
6	×	○	○	○	○	×	○	○
7	○	○	○	×	○	○	○	○
8	○	×	○	○	○	○	○	○
9	×	×	○	○	×	○	○	○
10	○	○	○	○	○	×	○	○
汚染検出率 (%)	60	60	100	60	60	100		
ch.No.	3			4				
回数	表面汚染密度 (Bq/cm ²)			表面汚染密度 (Bq/cm ²)				
	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8		
1	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	○	○	○	○	×	○	○
3	×	○	○	×	×	○	○	○
4	○	○	○	×	○	○	○	○
5	×	×	○	×	×	○	○	○
6	○	×	○	×	×	○	○	○
7	×	×	○	○	○	○	○	○
8	×	×	○	○	○	○	○	○
9	○	○	○	×	○	○	○	○
10	○	×	○	○	○	○	○	○
汚染検出率 (%)	50	50	100	50	60	100		

○：汚染検出， ×：汚染検出せず

2 走査速度: 10mm/秒

ch.No.	1	2	3	4
BG 計数率 (cps)	27.2	26.9	29.6	29.4
検出限界値 (Bq/cm ²)	0.48	0.47	0.45	0.49

ch.No.	1				2			
	表面汚染密度 (Bq/cm ²)				表面汚染密度 (Bq/cm ²)			
回数	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8
	×	○	○	○	×	×	○	○
1	○	○	○	○	×	×	○	○
2	○	○	○	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	×	×	○	○
4	○	○	○	○	○	○	○	○
5	×	○	○	○	×	○	○	○
6	×	○	○	○	○	×	○	○
7	○	×	○	○	×	○	○	○
8	×	○	○	○	×	×	○	○
9	○	×	○	○	○	○	○	○
10	×	×	○	○	×	○	○	○
汚染検出率 (%)	50	70	100	100	30	50	100	100
ch.No.	3				4			
回数	表面汚染密度 (Bq/cm ²)				表面汚染密度 (Bq/cm ²)			
	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8
1	○	○	○	○	×	○	○	○
2	×	○	○	○	×	○	○	○
3	○	×	○	○	×	×	○	○
4	○	○	○	○	×	○	○	○
5	×	○	○	○	×	○	○	○
6	○	○	○	○	○	×	○	○
7	○	×	○	○	○	×	○	○
8	×	×	○	○	×	○	○	○
9	×	×	○	○	○	×	○	○
10	×	○	○	○	×	×	○	○
汚染検出率 (%)	50	60	100	100	30	50	100	100

○: 汚染検出, ×: 汚染検出せず